End of Result Set

Print JP 57-100128 Generate Collection

L7: Entry 4 of 4

File: DWPI

Jun 22, 1982

DERWENT-ACC-NO: 1982-62792E

DERWENT-WEEK: 198230

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Epoxy! resin compsn. - consists of polyfunctional epoxy! resin, novolak cpd. as hardener, and 2-methyl imidazole pyromellitic anhydride salt as curing assistant

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

MATW

PRIORITY-DATA: 1980JP-0176107 (December 13, 1980)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 57100128 A

June 22, 1982

004

JP 86054326 B

November 21, 1986

000

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 57100128A

December 13, 1980

1980JP-0176107

INT-CL (IPC): C08G 59/62; H01L 23/30

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 57100128A

BASIC-ABSTRACT:

The epoxy resin compsn. consists of (1) polyfunctional epoxy resin (2) novolak type cpd. as hardener and (3) 2-methyl imidazol-pyromellitic anydride salt as curing assistant.

(2) and (3) are used in amts of 10 - 100 and 1 - 10 pts.wt. respectively per 100 pts.wt. of (1). (1) has an epoxy equiv. of 100-4000 and includes bisphenol type, alicyclic, novolak type, nitrogen-contg. and halogenated epoxy resins. (2) is obtained by interaction of phenol and formaldehyde in the presence of acidic catalyst. The compsn. may contain 30 - 80 wt.% filler e.g. (fused) silica, quartz glass powder, calcium carbonate, clay, talc, etc.

Compsn. can be filled under low pressure and exhibits excellent transfer formability. It is esp. useful for sealing semi-conductor devices such as IC and LSI.

TITLE-TERMS: POLYEPOXIDE RESIN COMPOSITION CONSIST POLYFUNCTIONAL POLYEPOXIDE RESIN NOVOLAK COMPOUND HARDEN METHYL IMIDAZOLE PYROMELLITIC ANHYDRIDE SALT CURE ASSIST

DERWENT-CLASS: A21

CPI-CODES: A05-A01B; A05-C03; A08-D; A08-D04; A12-E04; A12-E07C; BEST AVAILABLE COPY

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57-100128

⑤Int. Cl.³C 08 G 59/62// H 01 L 23/30

識別記号

庁内整理番号 7342-4 J 7738-5F 砂公開 昭和57年(1982)6月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈エポキシ樹脂組成物

顧 昭55—176107

②出 願 昭55(1980)12月13日

⑫発 明 者 松村昌弘

門真市大字門真1048番地松下電

工株式会社内

加発 明 者 大津正明

門真市大字門真1048番地松下電 工株式会社内

⑩発 明 者 橘田義弘

門真市大字門真1048番地松下電

工株式会社内

勿出 願 人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

個代 理 人 弁理士 松本武彦

明 粗

1. 発明の名称

②特

エポキシ樹脂組成物。

2. 特許請求の範囲

(i) 多官能エポキシ樹脂、硬化剤としてのノボラック系化合物および硬化助剤としての2ーメチルイミダゾール・無水ピロメリット酸塩が配合されているエポキシ樹脂組成物。

(2) 多官能エポキシ樹脂100重量部に対して2 ーメチルイミダゾール・無水ピロメリット酸塩が 1~10重量部配合されている特許請求の範囲第 1項記載のエポキシ樹脂組成物。

8. 発明の詳細な説明

との発明は、成形性(低圧充填性)の優れたエポキシ樹脂組成物、特にIC。LSI封止用として最適なエポキシ樹脂組成物に関するものである。

トランジスター、IC、LSI等の半導体装置は、 一般に、大量生産可能なトランスファー成形で樹脂對止されているが、トランスファー成形を行う場合、低圧で充分流動性のある對止材料を用いな いと、IC。LSI等の素子の断線が起こり、高価な半導体装置が不良品になってしまう。しかし、従来の市販品を含む材料には、低圧流動性を満足させるものはほとんどないのが現状である。

この発明者らは、このような情況に鑑み、低圧 成動性に優れ、しかも速硬化かつ貯 収安定性に優 れた半導体装置対止用エポキシ樹脂組成物を得る ために鋭意研究した結果、多官能エポキシ樹脂に、 硬化剤としてノボラック系化合物を配合すると、 もに、硬化助剤として2-メチルイミダゾール・ 無水ピロメリット酸塩を配合すると、所期の目的 を達成しうることを見いだしこの発明を完成する に到った。

すなわち、この発明は、多官能エポキシ樹脂、 使化剤としてのノボラック系化合物および硬化助 剤としての2ーメチルイミダゾール・無水ピロメ リット機塩が配合されているエポキシ樹脂組成物 をその受旨とするものである。

との発明で用いるエポキシ樹脂は、分子内に少なくとも 2 個のエポキシ基を有する化合物であれ

ば特に限定しない。しかし一般的には、エポキシ当量100~4000の通常のエポキシ樹脂が用いられる。例えば、ビスフェノール系エポキシ樹脂・脂環式エポキシ樹脂・ノボラック系エポキシ樹脂・含窒素エポキシ樹脂ならびにプロム化エポキシ樹脂のようなハロゲン化エポキシ樹脂があげられる。

また硬化剤として用いるノボラック系化合物としては、フェノール、クレゾール、キシレノール。レゾルシン等のフェノール類とホルムアルデヒドのようなアルデヒド類とを酸性触媒下で反応させて得られるものがあげられる。このようなノボラック系化合物の配合量は、エボキシ樹脂100重量部(以下『部」と略す)に対して、10~100部が好ましい。この範囲をはずれると、いずれの場合も硬化不足となり、硬化物の耐熱性、耐薬品性が劣るようになるからである。

との発明では、硬化促進剤として、 2 ーメチル イミダゾール・無水ピロメリット酸塩を用いる。 このように、硬化促進剤として 2 ーメチルイミダ ゾール・無水ピロメリット酸塩を用いることがこ

料をつくる場合は、つぎのようにして行われる。 すなわち、この発明のエポキシ樹脂組成物および その他の充填材等を混合する。混合は、ミキンン グロールや加圧ニーダー等の汎用の混合機械を使 用して行えばよい。ついで混合物を微粉砕し必要 に応じてタブレット化してトランスファー成形材 料とする。

この発明の樹脂組成物からつくられた成形材料は、低圧流動性に優れ、速硬化性、かつ材料の保存安定性が良好であるため、 I C 。L S I の封止用として最適であり、封止される半導体装置の成形時の不良率の低減を実現しりるようになるのである。

つぎに実施例について比較例と併せて説明する。 ・まず、つぎのようにして硬化助剤および硬化剤 を合成した。

(硬化助剤の合成)

無水ピロメリット酸 109 部を THF 109 部 化 格 解させた被をフラスコに入れた。 他方 簡 下ロート 中にこ 2 - メチルイミダゾール 8 2 部 を THF 8 2 の発明の特徴である。他のイミダゾール誘導体および有機酸の錯塩を用いても、この発明のような低圧流動性に優れたエボキシ樹脂組成物は得られないのである。硬化促進剤の触は、エボキシ樹脂100部に対して1~10部が好ましい。1部未満では硬化が遅く、また10部を超えると貯蔵安定性が悪くなる欠点が生じてくるからである。

なお、本発明のエポキシ樹脂組成物には、半導体装置封止剤として各種の充填剤を配合することが好ましい。例えば、シリカ・溶験シリカ・石英ガラス粉・炭酸カルシウム・クレー・タルク・けいそう士・マイカ・ケイ酸ジルコニウムなどがあげられ、全材料に対して30~80重量を(以下「多」と略す)用いることができる。

離型剤としては、モンタナワックス・カルナウパワックス・ステアリン酸、ステアリン酸を属塩などが用いられる。さらに必要に応じて難燃化剤・表面処理剤・染顔料などを用いることもできるのである。

との発明のエポキシ樹脂組成物を用いて成形材

部に密解させた被を入れた。常温で2-メチルイミダゾール被をフラスコ中に適下していくと、すぐに談費色の沈厳が生じ、この沈厳を評過し、乾燥させて2-メチルイミダゾール・無水ビロメリット酸塩を得た。実施例はもとより、比較例に用いる硬化助剤もこの方法と同様にして得られたものである。

(硬化剤の合成)

フェノール94部・87多ホルマリン 64.9部・
確酸 0.27部を撹拌器・冷却器・風度計を備えたフラスコに入れ、100℃で100分間反応させた。その後、薄膜乾燥脱水で水を取り除き、最終160℃で60分間反応させ脱露酸を行なってフェノールノボラックを得た。このノボラックは、遊離フェノール 0.2 まで数平均分子 12 700であった。またOH 当量は 104.2 であった。

つぎに、上記の硬化助剤および硬化剤を用いて つぎのようにして成形材料を得た。

(実施例1~8、比較例1~5) 各原料を下記のように配合した。

以上の実施例なよび比較例で得られたエポャン

樹脂成形材料の特性およびそれを用いて製造した

成形品の不良数を求めて次表に示した。実施例の

ものは、ふくれおよび断級がなく極めて優れてい

下 余

白)

(以

るととがわかる。

クレゾールノポラック型エポキシ樹脂 (エポキシ当量 207.9。

YDCN 220L, 東都化成社製)

フェノールノポラック(OH 当 104.2) : 50.1 部

硬化促進剤:次表に示すものを同表に示す量用いた。

溶融シリカ(S-1,電気化学工業社製) : 360部

ステアリン酸亜鉛

: 100部

カーポンプラック

エポキシシラン(KBM408,信越化学社製) : 1 部 上記配合物を100~120℃においてミキシングロ ールで20~80分間混練し、円板延び(測定条 件は次表の米3の保存安定性の場合と同じ)で 150~170㎜になった時、混練をやめ、シート状 材料をとり出し、冷却粉砕してエポキシ樹脂成形 材料を得た。

〔 実施例 4 。 5 〕

エポキシ樹脂として、エポキシ当量190のもの (N-740,大日本インキ社製)を100部用い、 フェノールノポラック(OH 当世 104.2)の量を 54.8部にした。それ以外は上配と同様にしてエポ 中シ樹脂成形材料を得た。

0 / 20 0 / 20 0 / 20 30/20 40/20 0 / 20 0 / 20 0 / 20 25/50 鬈 至 曵 0/20 28/50 0/20 0/20 0/20 20 0/20 50 9 ? ĸ 黚 Ж 定 ص S S 'n œ ∞ 张巴 7 7 7 8 体 Λ V 6-0 × 1 0-3 g_0 6-0 と登字 70 6-0 1 0-3 0-3 0-3 确 化 色 反应速度的 数,8ec 数,8ec 7.5 × 1 × × × ω, 00 S) œ œ ø. を存むる。 104 100 × 104 10 0 0 90 0 6 × × × × × X × × X œ .5 S 思则 œ 4 6 બં oi œ æ E (現) (現) 0.5 Š œ 8 Δ 化促進 ø < Ω Ç 氰 œ b 九数包1 10 **#**

・無木レダル酸塩 < # 0

コメコ **ペダンーグ・紙大 か** なお、上記の表の試験はつぎのようにして行っ。

※1 流動性(100℃で稠定)

試料189をタブレット成形し、このサンプル を図面の流動評価金型1のシリンダー部(2点) 2 亿入れ、ブランジャー8 で 5 0 , 100 , 200 ##/前の速度でサンプル4をノズル(2g-8L) 5 から押し出した時のせん断応力とせん断速度か ら見かけ粘度を計算した。

米2 硬化性

試料 2.2 1 のタブレットをキュラストメーター に掛けて硬化曲線を得た。そしてとの曲線から反 応速度定数を求めた。なお、キュラストメーター 条件はつぎのとおりに設定した。

: 4 0 kg/cd

度

: 170 °C

下金型振動数

: 6 回/分

上,下金型 クリアランス

米8 保存安定性

40℃で成形材料を放置し、流動性(円板延び

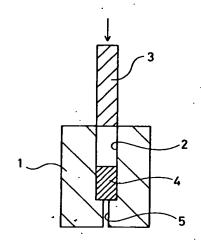
で測定,26.3 ブレス,ラム径180 mm。160℃でゲージ圧15 km/cml)の低下が初期の10%になったときの放置時間で示した。

米4 不良数

リードスレームのダイアタッチ部と各リード部とを、直径80μmの金線でワイアボンディングした試料を用い、170°C において80μ/cd ・1.5分の条件でトランスファー成形して。對止した。そして、成形後の①外観不良(ふくれ発生)、②各端子の導通状態を調べ、ふくれの発生および断線した個数(n)を全体(50個)中の不良数 n/50として示した。

4. 図面の簡単な説明 図面は流動性試験の説明図である。

> 特許出願人 松下電工株式会社 代理人 弁理士 松 本 武 安



BEST AVAILABLE COPY